マイクロ波パルスプラズマによる内面 DLC 成膜において プラズマ ON・OFF 時間が成膜の均一性に及ぼす影響

Effect of plasma on/off time on the uniformity of film thickness in

internal DLC coating with pulsed microwave plasmas

名大院工機械¹ 松井 良輔¹, ^O上坂 裕之¹, 梅原 徳次¹

Nagoya Univ.¹, Ryosuke Matsui¹, ^oHiroyuki Kousaka¹, Noritsugu Umehara¹

E-mail: kousaka@mech.nagoya-u.ac.jp

パイプ,シリンダー,ガイドブッシュ,金型のキャビティなどの 円筒形状内面に, DLC(Diamond-Like Carbon)膜を形成し, しゅう動 特性を改善したいというニーズがある.機械部品でニーズの多い, ミリメートルサイズの口径の細穴内面に成膜を行うには、比較的高 いプラズマ密度が必要となる.電子密度が~10¹² cm⁻³の高密度プラズ マを用いれば、電子密度が~10¹⁰ cm⁻³の低密度プラズマに比べてシ ース幅がおよそ1 桁小さくなるためである. 典型的な成膜条件にお いて電子密度以外の条件がすべて同じとすると、10¹² cm⁻³の高密度 プラズマの適用内径下限がおよそ1 mmで, 10¹⁰ cm⁻³の低密度プラズ マの適用内径下限がおよそ1 cmとなる. 我々はミリメートルサイズ の細穴内面にプラズマを作用させる手法として、管状基材への直流 負電圧印可と開口端からのマイクロ波投入を同時に行って、マイク 口波を内面に沿って伝搬させ、内面で高密度プラズマを生成する方 法(Microwave-sheath Voltage combination Plasma; MVP)を提案して きた[1,2]. さらに、同手法を用いて、Fig. 1 に示す装置によりステ ンレス鋼製1/4 インチパイプ(SUS304, JIS, 内径4.4 mm, 長さ50 mm) 内面へのDLC 成膜を試みた. しかしながら得られたDLC 膜の摩擦 特性および膜質の軸方向分布は、±35%程度のばらつきを有してお り著しく不均一であった[3].

J.Sengerらは、石英管に沿って伝搬する表面波による高密度プラズ マ柱のパルス点火を用いて石英管内面への成膜を行い、①高密度プ ラズマによる原料ガスの消費に原料ガスの拡散による供給が追いつ かなくなり、プラズマ点火時に内面の成膜ガスが枯渇すること、② 内面全域で完全に原料ガスを枯渇させた後にプラズマを消し、拡散 によって再びガスが内面に均一に充満するのを待ってから再点火す れば、膜厚分布が点火時の原料ガス濃度分布で決まるため、プラズ マ中の電子密度分布に関わらず膜が均一になること、を報告した. そこで我々も同様の考え方でパルスのON-OFF時間を決めて成膜を 行ったところ、上記の1/4 インチステンレス鋼製パイプの内面に対 するDLC 成膜において、軸方向のばらつきを±14%程度に抑えるこ とに成功した[5].本結果より、我々の系においても原料ガスの枯渇 が実際に起きていること、また均一に成膜するためには、ガスの枯 渇時間を踏まえた上で成膜条件を設定することが不可欠であること が示された。そこで、次のステップとして、プラズマの時間がガス



Figure 1. Schematic of a plasma CVD apparatus for internal DLC coating of narrow metal tube by using MVP method.



Figure 2. Effect of plasma on time on the DLC film thickness, obtained at z=5, 25, 45 mm.

枯渇時間に対して長くなったり短くなったりすることの成膜結果への影響を調べることにした.

成膜実験は Fig.1 の構成で行った. パイプの側面には内面プラズマの発光を漏えいさせるための内径 0.4 mm の穴が 10 mm ピッチで空いている. アルゴン,メタン,テトラメチルシランをそれぞれ 14,2,0.2 sccm の流量で投入し,チャンバー内の圧力 が 80 Pa となるように調整した. ピークパワー1000 W のマイクロ波(周波数 2.45 GHz) とパイプへの-200 V のバイアスを周波 数 f=10 Hz, Duty 比 $D_{mw}=0.5$, 1.6, 3.2, 4.0 %でパルス状に同時投入・印加し,パイプ内面に高密度プラズマを点火した.即ち,プラズマ ON 時間を 0.5, 1.6, 3.2, 4.0 ms と変化させて成膜を行った.尚,本条件下ではプラズマ中の Ar 原子からの発光 (696, 706 nm) および C₂ からの発光 (468-474 nm)のパルス波形計測より, 1.6 ms で管内のガスが枯渇することがわかっている[5]. 図 2 に z=5, 25, 45 mm の位置で計測された DLC 膜厚に及ぼすプラズマ ON 時間の影響を示す.本図より明らかな様に膜厚の絶対値および軸 方向のバラつきは、プラズマ ON 時間に大きく影響され、プラズマ ON 時間がガス枯渇時間と同じである場合にそれぞれ最大(2.4 μ m) および最小(±2%)となった.このような最適化を行うためには、ガス枯渇時間を正しく同定できることが必要であり、従って我々が提唱する C₂発光を利用したガス枯渇時間同定手法は大変重要である.

参考文献

- [1]. Kousaka, H., Umehara, N., Ono, K., and Xu, J., Jpn. J. Appl. Phys., 44 (2005), pp. L1154-L1157.
- [2]. Kousaka, H., Iida, H., and Umehara, N., Shinku, 49 (2006) pp. 183-185. [in Japanese]
- [3]. H. Kousaka, K. Mori, N. Umehara, N. Tamura, and T. Shindo, Surf. Coat. Technol., accepted (in press).
- [4]. J. Segner, Materials Science and Engineering, A140 (1991), pp.733-740.
- [5]. R. Matsui, K. Mori, H. Kousaka, N. Umehara, Diamond and Related Materials, 31 (2013) pp. 72-80.